## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平11-340588

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

(51) Int.C1. <sup>6</sup>		識別配号	. <b>F</b> . I			
H05K	1/02		H05K	1/02	В	
			•		J	
	3/00		•	3/00	<b>T</b> .	

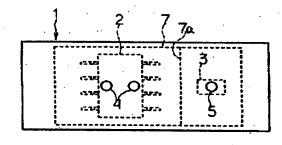
		審查請求	未蘭求 請求項の数1 OL (全 3 頁)				
(21)出願番号	<b>特膜平10-142472</b>	(71)出願人	396004981				
(22)出顧日	平成10年(1998) 5月25日		セイコープレシジョン株式会社 東京都中央区京橋二丁目 6 番21号				
,		(72)発明者	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
			千葉県習志野市西浜一丁目1番1号 セイ コープレシジョン株式会社内				
		(72)発明者					
•			千葉県晋志野市茜浜一丁目1番1号 セイ コープレシジョン株式会社内				
		(74)代理人					

# (54) 【発明の名称】 フレキシブルブリント基板

## (57)【要約】

【課題】 フレキシブルプリント基板の面積を小さくして小形機器への組み込みを容易にする。

【解決手段】 フレキシブルブリント基板1の回路素子の実装面1の反対側の面に回路素子2,3の端子と導通可能にしてある検査ランド4,5を設けてある。回路素子実装面側のスペースを節減してブリント基板の面積の狭小化を図ってカメラ等小型機器への組込みを容易にしてある。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 検査用プローブと接触可能な検査ランド が、回路素子の実装面の反対側の面であって上記回路素 子が位置する部分に対応して設けてあることを特徴とす るフレキシブルブリント基板。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】本発明は、IC等の回路素子が実装 されたフレキシブルプリント基板に関するものである。 [0002]

【従来の技術】ブリント基板にICやLSIその他の回 路素子を実装したときに、それらの回路素子が正常に機 能するか否かの検査が行われる。この検査は、図3に示 すように、プリント基板31の回路素子の実装面に回路 素子32の端子32aと導通可能な検査ランド33を設 け、この検査ランドにプローブ34を接触させることに より行われている。具体的には、プリント基板1の位置 決めをするために、支持台35によって下からブリント 基板の検査ランド33の背面を支持し、プローブによる 接触圧を一定にするようにしてある。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、ブリ ント基板の面積に余裕があれば問題はないが、例えばカ メラのプリント基板のように、面積を極端に小さくする ことが求められているものについては、検査ランドの設 置スペースをとる余裕がなくなることが問題となってい る。

#### [0004]

【課題を解決するための手段】上記の問題を解決するた めに、本発明は、ブリント基板の回路素子の実装面の反 30 対側の面に回路素子の端子と導通可能に検査ランドを設 け、実装面側のスペースを節減してプリント基板の面積 の狭小化を図ってある。検査の際にはブリント基板を裏 返しに検査治具上に載置し、回路素子の実装面の反対側 の面に設けられた検査ランドにプローブを接触させると とによって行われる。このとき、ブリント基板を水平に 維持した状態でプローブが接触可能とするように検査治 具の載置面に回路素子の高さに対応する段差を設けるよ うにしてある。

【0005】とくにフレキシブルブリント基板の場合に は、回路素子の背面側をブローブで押圧するので、ブロ 一ブの接触圧が所定値になるように回路素子の高さに合 わせて、プリント基板を水平に支持する段差を設けてあ ることが重要である。

【0006】回路素子の実装面を下にして検査治具台上 に載置すると、検査ランドがプリント基板の上面に位置 するので、これに対してブローブを降下させて接触させ ることにより回路素子の検査が可能となる。

#### [0007]

板は、プローブと接触可能な検査ランドが、回路素子の 実装面の反対側の面であって回路素子が位置する部分に 対応して設けてあるところに特徴がある。

#### [0008]

【実施例】以下本発明の一実施例について図面を参照し て説明する。図1、2に示すように、フレキシブルブリ ント基板1の一方の面にはLSIやIC等の回路素子 2. 3が実装してある。回路素子の実装面 l a の反対側 の面の回路素子が位置する部分には検査ランド4.5が 設けてある。検査ランド4、5は、検査用ブローブ6と 接触することにより回路素子の動作をチェックするため のものであり、実装面側に位置する回路素子の端子部2 aと導通可能としてある。検査ランド4,5が回路素子 の裏面側に設けられているため、フレキシブルブリント 基板1に設けられているにもかかわらず検査ランド4. 5の部分は回路素子により剛性が高くなっており、検査 用プローブ6との接触性をより確実にできる。

【0009】フレキシブルプリント基板1の検査は、図 示してあるように、回路素子の実装面1aを下にして検 20 査治具7上にセットして行われる。検査治具7の上面 は、フレキシブルプリント基板1 に実装されている回路 素子間の高さ(厚さ)に差がある場合には、それに対応 した段差7aを設けて基板1が水平になるように配慮し てある。図2は大きく描かれている方の回路素子(LS I) 2が小さく描かれている方の回路素子(IC) 3よ りも高さが高くなっているため、その差の分だけ検査治 具の上面の高さが異なるように段差7 a を設けてあると とを示している。検査治具7は、フレキシブルブリント 基板の検査装置(図示略)内に交換可能に取り付けられ ており、被検査フレキシブルブリント基板の種類が変わ るごとに対応するものと交換するようにしてある。

【0010】フレキシブルブリント基板1の検査は、検 査治具7上にフレキシブルブリント基板1の回路素子実 装面1a側を検査治具7上に当接するように載置した状 態で行われる。フレキシブルブリントケーブル1が所定 位置にセットされると、検査用ブローブ6が降下して、 各先端部を検査ランド4.5に接触することにより回路 素子と検査装置との導通が可能となる。これらの両者間 の導通により検査装置の計器が反応してフレキシブルプ リント基板 1 に実装された回路素子のチェックが行われ る。なお、被検査用回路素子の数が増加して、とれらの 髙さに幾通りもの差があるような場合には、これに対応 する段差を有する検査治具を用いればよい。また、検査 ランドが回路素子の裏面側に設けられていて剛性がある ため、検査治具7は必ずしも必要ではない。

### [0011]

【発明の効果】本発明によれば、検査ランドがフレキシ ブルブリント基板の回路索子の実装面の反対側でかつ回 路索子が位置する部分に対応するように設けてあるの

【発明の実施の形態】本発明のフレキシブルブリント基 50 で、回路索子の実装面側における検査ランドやそれへの

3

接続回路のスペースが節減可能となる。これによりフレキシブルブリント基板を小さくでき、カメラなど小形機器への組み込み容易なフレキシブルブリント基板を提供可能となる。また、回路素子の裏面側に検査ランドが設けられているために検査ランドの部分の剛性が高くなり、検査プローブの接触性が良くなる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】回路素子の実装面を下側にして検査治具上に載 置されている状態を示す平面図である。

【図2】高さを異にする回路素子を実装したフレキシブ\*10

\*ルプリント基板が回路素子実装面を下側にして検査治具 上に載置した状態を示す断面図である。

【図3】従来技術における基板の検査例を示す斜視図である。

### 【符号の説明】

1 フレキシブルブリント基板

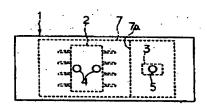
1 a 実装面

2, 3 回路素子

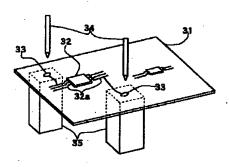
4.5 検査ランド

6 プローブ

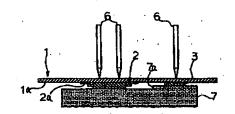
【図1】



【図3】



【図2】



# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-340588

(43)Date of publication of application: 10.12.1999

(51)Int.CI.

H05K 1/02

H05K 3/00

(21)Application number: 10-142472

Marie and the control of the control

(22)Date of filing:

25.05.1998

(71)Applicant : SEIKO PRECISION INC

(72)Inventor: TAKANO OSAMU

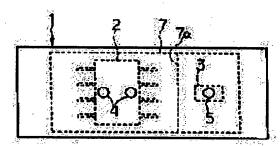
SHOJI HIDEKI

## (54) FLEXIBLE PRINTED BOARD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To facilitate integration of a flexible printed board with a small-sized equipment by r ducing the area of the board.

SOLUTION: Checking lands 4, 5 conductible with t rminals of circuit elements 2, 3 are provided on the opposite side surface of a mounting surface 1 of the elements of the flexible printed board 1. A space of the circuit element mounting surface side is reduced to make an area of the board narrow to facilitate the integration of the board into a small—sized equipment such as a camera or the like.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of r j ction]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Numb r of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Dat of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出關公開番号

# 特開平11-340588

(43)公開日 平成11年(1999)12月10日

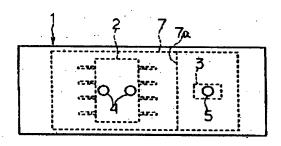
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	ΡI		•			
H05K	1/02		H05K	1/02	B J			
			•					
	3/00			3/00	τ .			
			來隨查審	未請求	請求項の数1	ÖL	(全 3 頁)	
(21)出願番号 特願		<b>特膜平10</b> -142472	(71)出願人					
(22)出顧日 平		平成10年(1998) 5月25日			セイコープレシジョン株式会社 東京都中央区京橋二丁目6番21号			
		I Maro F (1000) C / JED []	(72)発明者			3 U 1872	17	
			(1-)	子类具	ー 『志野市西浜一』 ノシジョン株式会		81号 セイ	
			(72)発明者					
				千葉県習	]志野市西浜一	<b>万</b> 目1≇	81号 セイ	
					/シジョン株式会			
•			(74)代理人	弁理士	松田 和子			
		•						
		-						

# (54)【発明の名称】 フレキシブルブリント基板

## (57)【要約】

【課題】 フレキシブルブリント基板の面積を小さくして小形機器への組み込みを容易にする。

【解決手段】 フレキシブルブリント基板1の回路素子の実装面1の反対側の面に回路素子2,3の端子と導通可能にしてある検査ランド4,5を設けてある。回路素子実装面側のスペースを節減してブリント基板の面積の狭小化を図ってカメラ等小型機器への組込みを容易にしてある。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 検査用プローブと接触可能な検査ランド が、回路素子の実装面の反対側の面であって上記回路素 子が位置する部分に対応して設けてあることを特徴とす るフレキシブルブリント基板。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】本発明は、IC等の回路素子が実装 されたフレキシブルプリント基板に関するものである。 [0002]

【従来の技術】ブリント基板にICやLSIその他の回 路素子を実装したときに、それらの回路素子が正常に機 能するか否かの検査が行われる。この検査は、図3に示 すように、プリント基板31の回路素子の実装面に回路 素子32の端子32aと導通可能な検査ランド33を設 け、この検査ランドにプローブ34を接触させることに より行われている。具体的には、プリント基板1の位置 決めをするために、支持台35によって下からプリント 基板の検査ランド33の背面を支持し、プローブによる 接触圧を一定にするようにしてある。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術は、ブリ ント基板の面積に余裕があれば問題はないが、例えばカ メラのプリント基板のように、面積を極端に小さくする ことが求められているものについては、検査ランドの設 置スペースをとる余裕がなくなることが問題となってい る。

### [0004]

【課題を解決するための手段】上記の問題を解決するた めに、本発明は、ブリント基板の回路素子の実装面の反 30 対側の面に回路素子の端子と導通可能に検査ランドを設 け、実装面側のスペースを節減してプリント基板の面積 の狭小化を図ってある。検査の際にはブリント基板を裏 返しに検査治具上に載置し、回路素子の実装面の反対側 の面に設けられた検査ランドにプローブを接触させると とによって行われる。このとき、プリント基板を水平に 維持した状態でプローブが接触可能とするように検査治 具の載置面に回路素子の高さに対応する段差を設けるよ うにしてある。

【0005】とくにフレキシブルプリント基板の場合に 40 は、回路素子の背面側をプローブで押圧するので、プロ ーブの接触圧が所定値になるように回路素子の高さに合 わせて、プリント基板を水平に支持する段差を設けてあ ることが重要である。

【0006】回路素子の実装面を下にして検査治具台上 に載置すると、検査ランドがブリント基板の上面に位置 するので、これに対してブローブを降下させて接触させ ることにより回路累子の検査が可能となる。

### [0007]

板は、プローブと接触可能な検査ランドが、回路素子の 実装面の反対側の面であって回路素子が位置する部分に 対応して設けてあるところに特徴がある。

#### [0008]

【実施例】以下本発明の一実施例について図面を参照し て説明する。図1,2に示すように、フレキシブルプリ ント基板1の一方の面にはLSIやIC等の回路素子 2. 3が実装してある。回路素子の実装面 1 a の反対側 の面の回路素子が位置する部分には検査ランド4.5が 設けてある。検査ランド4,5は、検査用プロープ6と 接触することにより回路素子の動作をチェックするため のものであり、実装面側に位置する回路素子の端子部2 aと導通可能としてある。検査ランド4, 5が回路素子 の裏面側に設けられているため、フレキシブルブリント 基板1に設けられているにもかかわらず検査ランド4. 5の部分は回路素子により剛性が高くなっており、検査 用プローブ6との接触性をより確実にできる。

【0009】フレキシブルプリント基板1の検査は、図 示してあるように、回路素子の実装面1aを下にして検 20 査治具7上にセットして行われる。検査治具7の上面 は、フレキシブルプリント基板 1 に実装されている回路 素子間の髙さ(厚さ)に差がある場合には、それに対応 した段差7aを設けて基板1が水平になるように配慮し てある。図2は大きく描かれている方の回路素子(LS I) 2が小さく描かれている方の回路素子(IC) 3よ りも高さが高くなっているため、その差の分だけ検査治 具の上面の高さが異なるように段差7 a を設けてあると とを示している。検査治具7は、フレキシブルブリント 基板の検査装置(図示略)内に交換可能に取り付けられ ており、被検査フレキシブルブリント基板の種類が変わ るごとに対応するものと交換するようにしてある。

【0010】フレキシブルブリント基板1の検査は、検 査治具7上にフレキシブルブリント基板1の同路素子実 装面1a側を検査治具7上に当接するように載置した状 態で行われる。フレキシブルブリントケーブル1が所定 位置にセットされると、検査用ブローブ6が降下して、 各先端部を検査ランド4、5に接触することにより回路 素子と検査装置との導通が可能となる。とれらの両者間 の導通により検査装置の計器が反応してフレキシブルプ リント基板 1 に実装された回路素子のチェックが行われ る。なお、被検査用回路素子の数が増加して、これらの 髙さに幾通りもの差があるような場合には、これに対応 する段差を有する検査治具を用いればよい。また、検査 ランドが回路素子の裏面側に設けられていて剛性がある ため、検査治具7は必ずしも必要ではない。

#### [0011]

【発明の効果】本発明によれば、検査ランドがフレキシ ブルブリント基板の回路素子の実装面の反対側でかつ回 路素子が位置する部分に対応するように設けてあるの 【発明の実施の形態】本発明のフレキシブルブリント基 50 で、回路素子の実装面側における検査ランドやそれへの 3

接続回路のスペースが節減可能となる。これによりフレキシブルブリント基板を小さくでき、カメラなど小形機器への組み込み容易なフレキシブルブリント基板を提供可能となる。また、回路素子の裏面側に検査ランドが設けられているために検査ランドの部分の剛性が高くなり、検査プローブの接触性が良くなる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】回路素子の実装面を下側にして検査治具上に載 置されている状態を示す平面図である。

【図2】高さを異にする回路素子を実装したフレキシブ\*10

\*ルブリント基板が回路素子実装面を下側にして検査治具 上に載置した状態を示す断面図である。

【図3】従来技術における基板の検査例を示す斜視図である。

## 【符号の説明】

**1** フレキシブルブリント基板

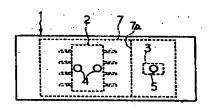
1 a. 実装面

2, 3 回路素子

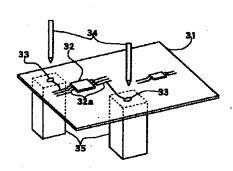
4.5 検査ランド

6 ブローブ

【図1】



【図3】



【図2】

